

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ВАРИКАПЫ

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ДОБРОТНОСТИ

Издание официальное

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ВАРИКАПЫ

Метод измерения добротности

Variable capacitance diodes.
Method for measuring the quality factor.

ГОСТ
18986.19—73

Взамен
ГОСТ 14094—68

МКС 31.080.10

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 12 июля 1973 г. № 1693
дата введения установлена

01.01.75

Ограничение срока действия снято по протоколу № 2—92 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2—93)

Настоящий стандарт распространяется на варикипы емкостью более 4 пФ в диапазоне частот 0,25—1000 МГц и устанавливает два метода измерения добротности варикипов.

Второй метод допускается применять при аттестации контрольных образцов варикипов или мер емкостной добротности.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 3199—81 в части метода измерения добротности.

Общие условия при измерении должны соответствовать требованиям ГОСТ 18986.0—74 и настоящего стандарта. Требования настоящего стандарта являются обязательными.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. (Исключен, Изм. № 2).

1.2. Измерение добротности варикипов проводится при фиксированной емкости либо при фиксированном напряжении смещения, значения которых указывают в технических условиях на варикипы конкретных видов.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.3. (Исключен, Изм. № 3).

1.4. Измерение добротности проводят в режиме малого сигнала, если при измерении добротности постоянное напряжение на варикипе не более 4 В, переменное напряжение высокой частоты на варикипе не должно превышать 100 мВ_{ЭФ}; если при измерении добротности постоянное напряжение на варикипе более 4 В, переменное напряжение высокой частоты на варикипе U_m в мВ_{ЭФ}

$$U_m = (70 \text{ мВ} + 0,015 U_c), \quad (1)$$

где U_c — напряжение смещения при измерении добротности варикипов измеряемого типа, установленное в ТУ.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1.5. При измерении добротности варикипов при фиксированном смещении напряжение смещения должно устанавливаться с погрешностью в пределах $\pm 3\%$.

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

Издание (май 2004 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в феврале 1979 г., июне 1982 г., феврале 1991 г.
(ИУС 4—79, 9—82, 5—91).

C. 2 ГОСТ 18986.19—73

При измерении добротности варикапов при фиксированной емкости требования к погрешности установки напряжения смещения не нормируются. Нестабильность напряжения смещения за время измерения добротности варикапа и пульсация напряжения смещения не должны превышать 10 % амплитуды напряжения высокой частоты на варикапе.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.6. Добротность ненагруженного контура Q_c (резонансной системы), к которому подключаются измеряемый варикап, должна быть, по возможности, близка к значению добротности измеряемого варикапа Q_c или больше ее, при этом допускается применение схем компенсации потерь в контуре.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1.7, 1.8. (Исключены, Изм. № 3).

1.9. Значение индуктивности ΔL выводов держателя варикапов до потенциальных контактов переменного конденсатора при измерении добротности методом, изложенным в разд. 2, должна удовлетворять условию

$$\Delta L < \frac{0,03}{(2\pi f)^2 C_b}, \quad (2)$$

где C_b — емкость варикапа.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.10. Погрешность градуировки шкалы отсчета емкости измеряется при измерении добротности методом, изложенным в разд. 2, должна быть не более 3 %.

1.11. Относительная погрешность отсчета частоты при измерении добротности методом, изложенным в разд. 3, должно быть не более 10^{-6} за время измерения.

1.12. Нестабильность частоты генератора измерителя добротности должна быть не более 10^{-6} за время измерения. Погрешность установления частоты измерения должна быть в пределах $\pm 1\%$.

1.10—1.12. (Измененная редакция, Изм. № 3).

1.13. Нестабильность амплитуды генератора высокой частоты должна быть не более 1 % между калибровками по пп. 2.3.1 или 2.3.2.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. МЕТОД 1

2.1а. Принцип измерения

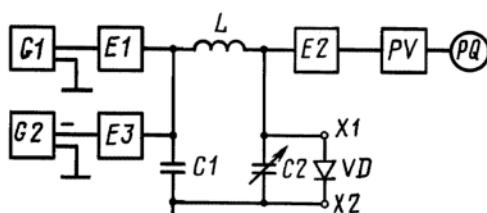
Метод основан на определении добротностей контура с варикапом и без него при настройке контура в резонанс путем изменения емкости контура или варикапа. Измерения проводят на фиксированной частоте, значение которой должно быть указано в стандартах или ТУ на варикапы конкретных типов.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

2.1. (Исключен, Изм. № 1).

2.2. Подготовка к измерению

2.2.1. Принципиальная электрическая схема измерения добротности должна соответствовать указанной на черт. 1.



$G1$ — генератор высокой частоты; $G2$ — источник напряжения смещения; $E1, E2$ — элементы связи; $E3$ — элемент развязки; $C1$ — конденсатор; L — индуктивность контура; $C2$ — емкость контура; PV — селективный усилитель; PQ — измерительный прибор; VD — измеряемый варикап; $X1, X2$ — контакты подключения варикапа, воздушного конденсатора или меры емкостной добротности

2.2.2. Параметры элемента связи $E1$ между генератором высокой частоты $G1$ и контуром $L, C2, C1$ должны быть такими, чтобы при уменьшении добротности контура в три раза напряжение на элементе связи изменялось не более 2 %.

2.2.3. Параметры элемента связи $E2$ между контуром и селективным усилителем PV должны быть такими, чтобы при отключении элементов L и $C2$ стрелка прибора PQ отклонилась не более чем на 1 % шкалы, а при удалении элемента связи $E2$ напряжение на контуре не должно изменяться более чем на 2 %.

2.2.1—2.2.3. (Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

2.2.4. Емкость конденсатора $C1$ должна быть такой, чтобы выполнялось условие

$$C1 > 200 \text{ } C2, \quad (3)$$

где $C2$ — значение резонансной емкости контура при отключенном варикапе.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.2.5. Параметры элемента развязки $E3$ по высокой частоте должны быть такими, чтобы выполнялось условие

$$|Z| > \frac{100}{2\pi f C1}, \quad (4)$$

где $|Z|$ — модуль выходного полного сопротивления со стороны контура $L, C2, C1$.

2.2.6. Элемент развязки $E3$ должен пропускать обратный ток варикапа так, чтобы падение напряжения смещения на внутреннем сопротивлении $E3$ составляло не более 0,5 % фиксированного напряжения смещения.

2.2.7. Параметры элементов связи $E1, E2$ по постоянному току должны быть такими, чтобы при изъятии варикапа из клемм $X1, X2$ напряжение смещения изменилось не более чем на 1 %.

2.2.5—2.2.7. (Измененная редакция, Изм. № 2).

2.2.8. Нелинейность амплитудной характеристики системы селективный усилитель — измерительный прибор должна быть в пределах ± 2 %.

2.2.9. Параметры контура: добротность Q_c , его полная резонансная и емкость C_c должны быть определены с погрешностью, соответствующей требованиям разд. 4.

2.2.10. Отношение Q_c/C_c определяют по формуле

$$\frac{Q_c}{C_c} = 2\pi f R \frac{\alpha_1 - \alpha_2}{\alpha_2}, \quad (5)$$

где f — частота измерения, Гц;

R — резистор, подключаемый к клеммам $X1$ и $X2$. Сопротивление резистора должно быть из-

мерено на частоте f с погрешностью в пределах ± 5 %;

α_1 и α_2 — максимальное показание прибора PQ при настройке контура в резонанс без резистора и с резистором соответственно.

Сопротивление резистора R подбирают так, чтобы соблюдалось условие $\alpha_2 \geq 0,5 \alpha_1$.

Допускаются другие способы определения параметров Q_c и C_c , например, при помощи мер емкостной добротности, подключаемой к контактам $X1$ и $X2$ вместо резистора R . При этом должна обеспечиваться погрешность результата измерения, удовлетворяющая требованиям разд. 4.

2.2.8—2.2.10. (Измененная редакция, Изм. № 3).

2.2.11. Погрешность измерительного прибора PQ должна находиться в пределах ± 1 %.

2.2.12. Напряжение смещения на диоде должно быть установлено с погрешностью в пределах ± 3 %.

2.2.13. Допускается иметь иные требования к погрешности элементов схемы, если погрешность результата измерения удовлетворяет требованиям разд. 4.

2.2.11—2.2.13. (Введены дополнительно, Изм. № 3).

2.3. Проведение измерения и обработка результатов

2.3.1. Перед измерением проводят калибровку прибора PQ . Для этого настраивают контур переменным конденсатором $C2$ в резонанс по максимальному отклонению стрелки прибора PQ . Регулируя усиление усилителя, устанавливают стрелку прибора PQ на конец шкалы. К клеммам $X1, X2$ подключают варикап и подают на него заданное напряжение смещения. Конденсатором $C2$ вновь настраивают контур $L, C2, VD$ в резонанс, при этом записывают показание прибора $PQ - \alpha$, выраженное в долях от максимального значения, принимаемого за единицу.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).